

- |             |             |                 |
|-------------|-------------|-----------------|
| 1 長さ        | 11 密度       | 21 測光量・放射量(全2頁) |
| 2 幾何学量(全3頁) | 12 粘度・動粘度   | 22 放射線          |
| 3 時間        | 13 体積(衡量法)  | 23 放射能(全2頁)     |
| 4 質量        | 14 音響(全2頁)  | 24 中性子(全4頁)     |
| 5 力         | 15 超音波      | 25 温度           |
| 6 トルク       | 16 振動加速度    | 26 湿度           |
| 7 圧力(全2頁)   | 17 衝撃加速度    | 27 熱物性(全2頁)     |
| 8 重力加速度     | 18 角振動・角速度  | 28 硬さ           |
| 9 真空(全2頁)   | 19 直流・低周波   | 29 衝撃値          |
| 10 流量(全2頁)  | 20 高周波(全2頁) | 30 粒子・粉体特性(全2頁) |
|             |             | 31 純度           |
|             |             | 32 薄膜・多層膜       |
|             |             | 33 濃度           |
|             |             | 34 分子量          |

計量器の構成要素及び検査装置の試験(全3頁)

その他(全2頁)

OIML適合性試験(全2頁)

依頼試験手数料額は、校正手数料(消費税抜)と下記校正証明書手数料(消費税抜)を加えた額に消費税額を加えた金額になります。

校正証明書手数料(消費税抜)

和文	1部につき	1,300円
英文	1部につき	2,300円

証明書の発送はご入金後となります。

手数料は、当所の都合で校正・試験が完了しなかった場合以外、お返しできません。 当所の都合により完了しなかった場合には、全額返却致します。

別表2-1 計量の標準に係る校正、試験等

2020.7.1

依頼試験手数料の額（消費税等抜き）は、別表2-1内手数料の額に校正証明書手数料の額を加えた額になります。

校正証明書手数料

和文 1部につき 1,300円（正本・複本とも同じ）

英文 1部につき 2,300円（正本・複本とも同じ）

No.	種類	項目	細目	手数料（基本料金）（円）		備考
1	長さ	ブロックゲージ絶対測定	短尺(呼び寸法が100 mm以下のもの)	1個につき	32,800	
			中尺(呼び寸法が100 mmを超え250 mm以下のもの)	1個につき	48,500	
			長尺(呼び寸法が250 mmを超え1 000 mm以下のもの)	1個につき	95,400	
			短尺(密着済みブロックゲージ、呼び寸法が100 mm 以下のもの)	1個につき	32,400	
		ブロックゲージ(遠隔校正)	呼び寸法が0.5 mm以上100 mm以下のもの	1個につき	73,700	
		低熱膨張係数ブロックゲージ絶対測定	短尺(呼び寸法が100 mm以下のもの)	1個につき	32,800	熱膨張係数は $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ 以下
			中尺(呼び寸法が100 mmを超え250 mm以下のもの)	1個につき	48,500	熱膨張係数は $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ 以下
			長尺(呼び寸法が250 mmを超え1 000 mm以下のもの)	1個につき	95,400	熱膨張係数は $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ 以下
			短尺(密着済みブロックゲージ、呼び寸法が100 mm 以下のもの)	1個につき	32,400	熱膨張係数は $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ 以下
		段差高さ	ブロックゲージ対(それぞれのブロックゲージの呼び寸法は 0.5 mm以上 100 mm以下、呼び寸法の差は -10 $\mu$ m以上 10 $\mu$ m以下の範囲)	1対につき	61,100	基本の1対のうちの1本を基準として、ブロックゲージが1本増す毎に28,900円を加算する。呼び寸法が30 mm未満の場合8本まで、30 mm以上50 mm未満の場合4本まで、50 mm以上の場合1本のみ追加可能。
			段差高さゲージ	1個4段差まで	70,700	1段差を追加する毎に3,100円を加算する。
		標準尺絶対測定(指定線間)	普通精度(精度が2 $\mu$ m又はそれより低いもの)	1個につき	207,200	
			高精度(精度が0.5 $\mu$ m又はそれより低いもの)	1個につき	341,600	
		距離計	光波距離計(校正範囲5 m以上200 m以下)	距離計本体・反射鏡1組につき	289,800	反射鏡を1個追加する毎に101,600円を加算する。
		干渉測長器	校正範囲1 m以上100 m以下	1個10箇所まで	167,500	
		固体屈折率	BK7又は同等品(真空中波長632.99 nmにおいて屈折率が1.51以上1.52以下)	1個3測定箇所につき	222,200	1測定箇所を追加する毎に49,200円を加算する。
			BK7又は同等品(真空中波長546.2 nmにおいて屈折率が1.51以上1.53以下)	1個3測定箇所につき	207,400	1測定箇所を追加する毎に54,000円を加算する。
2	幾何学量	触針式段差・深さ		1個につき	276,400	
		ボールプレート・ホールプレート	レーザ干渉測定 560 mm以下	1個につき	256,900	
			参照標準との比較測定 700 mm以下	1個につき	211,700	

ステップゲージ	1 020 mm以下	1個につき	236,100	
ボールバー	レーザ干渉測定 720 mm以下	1個につき	227,000	
	参照標準との比較測定 1 020 mm以下	1個につき	105,500	
一次元グレーティング	23 nm以上8 μm以下	1個につき	451,100	
二次元グレーティング	100 nm以上8 μm以下	1個につき	930,800	
二次元グリッド	マーク中心座標 350 mm × 350 mm まで	1個100測定箇所につき	374,200	1測定箇所を追加するごとに2,700円を追加する。
線幅(パターン寸法)	30 nm 以上0.5 μm 以下	1個につき	417,500	試料外形 105 mm × 105 mm × 10 mm 以下
オートコリメータ	最大校正範囲 ± 5 ° 校正点数約200 点	1個1軸	188,500	2軸目を校正する場合は、134,300円を加算する。
線幅フォトマスク	500 nm以上 10 μm以下	1個につき	342,300	1校正線を追加するごとに152,300円を加算する。
CTによる幾何形状測定	10 mm以上200 mm以下	1項目につき		形状等により別途見積
CMMによる幾何形状測定		1項目につき		形状等により別途見積
CMM(遠隔校正)	測定長さ 1 m以下	1個につき	232,600	
光学式段差測定	0.02 μm以上0.5 μm以下	1個につき	259,800	
ロータリーエンコーダ		1個につき	231,000	
多面鏡	6面以下	1個につき	131,400	
	7面以上24面以下	1個につき	143,000	
	25面以上48面以下	1個につき	189,300	
表面粗さ測定	粗さ用標準片	1個につき	286,100	
平面度	平面度:参照オプティカルフラットによる比較測定 300 mm(12インチ)以下、形状データの添付をしない場合	1個1面につき	171,500	1校正面を追加する毎に 34,700円を加算する。
	平面度:参照オプティカルフラットによる比較測定 300 mm(12インチ)以下、形状データをCD-ROMで添付する場合	1個1面につき	221,200	1校正面を追加する毎に 47,100円を加算する。
	真直度:形状測定機による一次元形状の校正 50 mm 以上500 mm 未満	1個1ラインにつき	278,800	1ラインを追加する毎に51,800円を加算する。
	真直度:形状測定機による一次元形状の校正 500 mm 以上1 050 mm 以下	1個1ラインにつき	322,300	1ラインを追加する毎に 61,100円を加算する。
球面度	基準球面との比較の場合	1個につき	165,000	
	二球面比較法による絶対測定の場合	1個あるいは一対につき	314,200	
AFM方式段差測定		1個につき	757,800	
AFM 式表面粗さ測定	算術平均粗さRa : 1 nm 以上50 nm 以下	1個につき	405,700	試料外形 20 mm x 20 mm x 4 mm 以下
真円度	直径の呼び寸法が100 mm以下の回転精度検査用標準器 範囲0 mm以上100 mm以下のもの	1個につき	105,000	

		真円度測定機用倍率校正器	切欠き量の呼び寸法2 $\mu\text{m}$ 以上500 $\mu\text{m}$ 以下, 直径の呼び寸法2 mm 以上90 mm 以下	1個につき	214,200		
		小径内径(最小二乗直径)	直径の呼び寸法 0.5 mm 以上2 mm 以下	1個につき	175,800		
		歯形	基礎円直径: 25 mm 以上200 mm 以下	1個につき(1 測定ライン含 む)	295,400	1測定ラインを追加する毎に9,700円を加算す る。	
		歯すじ	基準円直径: 25 mm 以上200 mm 以下	1個につき(1 測定ライン含 む)	295,400	1測定ラインを追加する毎に9,700円を加算す る。	
		歯車ピッチ	基準円直径: 60 mm 以上300 mm 以下	1個につき	285,000		
3	時間	周波数(遠隔校正)	周波数:5 MHz, 10 MHz	1年間12回に つき	165,200	初期設置調整時に申請者側使用場所にて 動作確認が必要となった場合、研究所職員 の出張に係る実費を加算する。	
				初期設置調整 手数料(初回 のみ)	66,300	初期設置座標測定を希望される場合は、手 数料として80,300円と研究所職員の出張に 係る実費を加算する。	
4	質量	分銅又はおもり	校正範囲が1 mg以上 100 g未満のもの	1試料につき	60,700	比較測定については60,700円を加算する。	
			校正範囲が100 g以上20 kg以下のもの	1試料につき	92,200	比較測定については92,200円を加算する。	
			校正範囲が 20 kgを超え 1 050 kg以 下のもの	相対拡張不確かさが15 ppm以下	1試料につき	149,400	質量調整のある場合は149,400円を加算す る。
				相対拡張不確かさが15 ppmを超えるもの	1試料につき	74,900	質量調整のある場合は74,900円を加算する。
			校正範囲が1 050 kgを超え5 200 kg以下のもの	1個につき	287,300	質量調整のある場合は287,300円を加算す る。	
		特性試験	分銅の体積・磁化率及び表面粗さ	1個につき	54,600		
5	力	高精度力計	最大荷重が 1 MN以下のもの	1個につき	194,300	1試験項目を追加する毎に194,300円を加算 する。	
			最大荷重が 1 MNを超えるもの	1個につき	466,600	1試験項目を追加する毎に基本料金の 466,600円を加算する。	
6	トルク	トルクメータ	校正範囲が 0.01 N・m以上、10 N・m以下のもの	1台8ステップ 内、片側ねじり につき	136,000	左右ねじりの場合、103,000円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に16,400円 を加算する(但し最大10ステップ)。	
			校正範囲が 2 N・m以上、1 kN・m以下のもの	1台8ステップ 内、片側ねじり につき	153,200	左右ねじりの場合、135,600円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に17,500円 を加算する(但し最大10ステップ)。	
			校正範囲が 200 N・m以上、20 kN・m以下のもの	1台8ステップ 内、片側ねじり につき	204,500	左右ねじりの場合、161,800円を加算する。校 正ステップを1ステップ増す毎に21,300円を 加算する(但し最大10ステップ)。	
		参照用トルクレンチ	校正範囲が 0.1 N・m以上、10 N・m以下のもの	1台8ステップ 内、片側ねじり につき	136,000	左右ねじりの場合、103,000円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に16,400円 を加算する(但し最大10ステップ)。	
			校正範囲が 2 N・m以上、1 kN・m以下のもの	1台8ステップ 内、片側ねじり につき	153,200	左右ねじりの場合、135,600円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に17,500円 を加算する(但し最大10ステップ)。	
			校正範囲が 200 N・m以上、5 kN・m以下のもの	1台8ステップ 内、片側ねじり につき	204,500	左右ねじりの場合、158,500円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に 21,300円 を加算する(但し最大10ステップ)。	
7	圧力	気体	ゲージ圧力 5 kPa以上100 MPa以下	1台につき(校 正圧力点5点 以下)	217,400	校正圧力点が6点以上の場合1点につき 43,400円を加算する。	

			絶対圧力 5 kPa以上7 MPa以下	1台につき(校正圧力点5点以下)	331,100	校正圧力点が6点以上の場合1点につき66,100円を加算する。 真空排気による絶対圧力校正。
			絶対圧力110 kPa以上100 MPa以下	1台につき(校正圧力点5点以下)	217,400	校正圧力点が6点以上の場合1点につき43,400円を加算する。 大気圧計を使用した絶対圧力校正。
			差圧1 Pa以上10 kPa以下 (ライン圧力100 kPa ± 10 kPa)	1台につき(校正圧力点4点以下)	368,300	校正圧力点が5点以上の場合1点につき73,600円を加算する。
			絶対圧力10 Pa以上10 kPa以下	1台につき(校正圧力点4点以下)	368,300	校正圧力点が5点以上の場合1点につき73,600円を加算する。
			遠隔校正 大気圧 (絶対圧力 95 kPa以上 105 kPa以下)	1台につき	196,200	仲介器の往復移送費用、支援要員の出張に掛かる実費を加算する。
			遠隔校正 差圧10 Pa以上10 kPa以下 (ライン圧力 大気圧)	1台につき(校正圧力点7点以下)	284,500	仲介器の往復移送費用、支援要員の出張に掛かる実費を加算する。
	液体		1 MPa以上500 MPa以下	1台につき(校正圧力点5点以下)	216,200	校正圧力点が6点以上の場合1点につき43,100円を加算する。
			100 MPa以上1 GPa以下	1台につき(校正圧力点5点以下)	259,300	校正圧力点が6点以上の場合1点につき51,800円を加算する。
			遠隔校正 圧力10 MPa以上 100 MPa以下	1台につき(校正圧力点10点以下)	260,500	仲介器の往復移送費用、支援要員の出張に掛かる実費を加算する。
8	重力加速度	絶対重力計		1台につき	749,900	
9	真空	真空計	粘性(スピニングローター)真空計(0.1 mPa以上10 Pa以下のもの)	1個1校正点につき	281,500	GPIB、RS232Cインターフェースで制御可能なスピニングローター真空計であること 代表点として0.1 Paにおいて校正を実施し、校正点数を増やす場合は1点につき140,900円を加算する。
			隔膜真空計(0.1 Pa以上150 Pa以下のもの)	1個3校正点につき	249,500	GPIB、RS232Cインターフェースを有すること。 3校正点数を追加する毎に20,300円を加算する。
			電離真空計 $1 \times 10^{-6}$ Pa以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa以下	1個につき	287,300	
			電離真空計 $1 \times 10^{-9}$ Pa 以上 $2 \times 10^{-6}$ Pa以下	1個につき	374,600	校正ガスを窒素とする。金属ガスケットで真空装置に接続できる真空計に限る。
			分圧真空計 $1 \times 10^{-6}$ Pa以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa以下 (N <sub>2</sub> ,Ar,He,H <sub>2</sub> )	1個1ガスにつき	320,300	追加ガスを1種追加する毎に98,500円を加算する。
	リーク		標準リーク $1 \times 10^{-10}$ Pa m <sup>3</sup> /s以上 $1 \times 10^{-6}$ Pa m <sup>3</sup> /s以下	1個につき	262,900	真空へのリーク量(ヘリウム)
			標準リーク $5 \times 10^{-7}$ Pa m <sup>3</sup> /s以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa m <sup>3</sup> /s以下	1個1ガスにつき	232,200	真空へのリーク量(ヘリウム、アルゴン) 校正点1点追加につき、55,300円を加算する。
			標準リーク $5 \times 10^{-7}$ Pa m <sup>3</sup> /s以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa m <sup>3</sup> /s以下	1個につき	148,300	大気中へのリーク量(窒素) 校正点1点追加につき、32,800円を加算する。
			標準リーク $5 \times 10^{-7}$ Pa m <sup>3</sup> /s以上 $1 \times 10^{-4}$ Pa m <sup>3</sup> /s以下	1個1ガスにつき	202,000	大気中へのリーク量(ヘリウム、R134a、水素5% + 窒素95%混合ガス、アルゴン) 校正点1点追加につき、50,300円を加算する。

		標準コンダクタンス	標準コンダクタンスエレメント N <sub>2</sub> に対して、 $1 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{s}$ 以上 $1 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{s}$ 以下(追加ガスとして、Ar, He, H <sub>2</sub> )	1個1ガスにつき	81,200	一次圧力を $10^2 \text{ Pa}$ 以上 $10^5 \text{ Pa}$ 以下で、コンダクタンスの圧力依存性が3 %以下である圧力範囲で測定。真空対応の接続配管を有し、ガス放出の小さいもの(二次圧力の到達圧力 $10^{-6} \text{ Pa}$ 以下)。追加ガスを1種追加することにより、66,200円を加算する。
10	流量	気体小流量	音速ノズル(衡量法)(口径0.05 mm以上2.5 mm以下のもの)	1個気体1種類につき	765,100	
			音速ノズル(比較法)(口径0.05 mm以上2.5 mm以下のもの)	1個気体1種類につき	449,400	
			気体小流量用流量計(比較法)	1台気体1種類につき	449,400	
			気体小流量用流量計(PVT法)	1台気体1種類につき	463,400	
		気体中流量	気体用流量計(閉ループ法)	1個1圧力5流量につき	239,400	1圧力を追加する毎に215,600円を加算する。同一圧力で5流量を超える場合は1流量毎に24,000円を加算する。
		気体中流速	超音波流速計等(1.3 m/s以上40 m/s以下)	1個10流速につき	290,000	1流速を追加する毎に57,900円を加算する。
			レーザ流速計(1.3 m/s 以上40 m/s 以下)	1個につき	329,800	
		気体大流速	ピトー管(40 m/s 以上90 m/s 以下)	1個6流速につき	319,700	ピトー管の取り付け及び取り外し、並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。6流速を超え1流速増す毎に、33,600円を加算する。
		液体小流量	水用流量計(口径25 mm以下)	1個5流量につき	296,200	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。5流量を超え1流量を追加する毎に38,000円を加算する。
		液体大流量及び中流量	水用流量計(口径15 mm以上50 mm未満)	1個5流量につき	385,800	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。5流量を超え1流量を追加する毎に42,300円を加算する。
			水用流量計(口径50 mm以上175 mm以下)	1個5流量につき	473,700	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。5流量を超え1流量を追加する毎に56,600円を加算する。
			水用流量計(口径175 mmを超え400 mm以下)	1個5流量につき	708,700	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。5流量を超え1流量を追加する毎に78,700円を加算する。
			水用流量計(口径400 mmを超え600 mm以下)	1個5流量1温度につき	3,774,500	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。5流量を超え1流量を追加する毎に190,800円を加算する。1校正温度点を追加する毎に843,200円を加算する。

		石油小流量(軽油・灯油・工業ガソリン)	範囲:0.02 L/h 以上 100 L/h 以下 4.4×10 <sup>-6</sup> kg/s 以上 2.2×10 <sup>-2</sup> kg/s 以下		1個3流量につき	295,000	校正器物の形状が特殊な場合又は特殊な形状の配管等を使用する場合に必要な費用は含まない。 1流量を追加する毎に45,800円を加算する。 1校正温度を追加する毎に59,400円を加算する。 1校正試験液を追加する毎に85,800円を加算する。
		石油中流量(軽油・灯油・低粘度工業用潤滑油(スピンドル油))・工業ガソリン	範囲:0.1 m <sup>3</sup> /h以上15 m <sup>3</sup> /h以下、0.022 kg/s以上3.4 kg/s以下		1個3流量につき	274,700	校正器物の形状が特殊な場合又は特殊な形状の配管等を使用する場合に必要な費用は含まない。 1流量を追加する毎に34,000円を加算する。 1校正温度を追加する毎に71,200円を加算する。 1校正試験液を追加する毎に145,800円を加算する。
		石油大流量(軽油・灯油)	範囲:3 m <sup>3</sup> /h以上300 m <sup>3</sup> /h以下、0.67 kg/s以上67 kg/s以下		1個3流量につき	1,385,100	校正器物の形状が特殊な場合又は特殊な形状の配管等を使用する場合に必要な費用は含まない。 1流量を追加する毎に347,900円を加算する。 1校正温度を追加する毎に173,800円を加算する。 1校正試験液を追加する毎に347,900円を加算する。
11	密度	シリコン単結晶	圧力浮遊法による密度差校正 密度差:0 kg/m <sup>3</sup> 以上0.035 kg/m <sup>3</sup> 以下 質量:5 g以上1 010 g以下		1個につき	233,900	
		固体材料	液中ひょう量法による固体密度測定 密度:800 kg/m <sup>3</sup> 以上20 000 kg/m <sup>3</sup> 以下 質量:30 g以上1 010 g以下		1個につき	248,100	
		PVT性質	作動流体, 圧力0 MPa ~ 20 MPa, 密度 0 kg m <sup>-3</sup> ~ 1 700 kg m <sup>-3</sup> , 温度 260 K ~ 423.15 K		1温度1圧力につき	97,900	同一温度の場合, 追加1点につき 18,200 円を加算する。
		密度標準液	水溶液 温度20 , 密度998 kg/m <sup>3</sup> ~ 1 050 kg/m <sup>3</sup>		1試料につき	161,000	
12	粘度・動粘度	粘度標準液	動粘度	-40 ~ 100 (20 ~ 40 を除く)	使用細管粘度計1種類1指定温度につき	101,700	使用細管粘度計が同一の場合において、1指定温度を追加する毎に34,400円を加算する。
			粘度	-40 ~ 100 (20 ~ 40 を除く)	使用細管粘度計1種類1指定温度につき	152,000	使用細管粘度計が同一の場合において、1指定温度を追加する毎に55,300円を加算する。
		非ニュートン性液体	ずり応力	2×10 <sup>-3</sup> Pa以上34 Pa以下	1個ずり速度3点につき	202,700	ずり速度を1点追加する毎に18,900円を加算する。
13	体積(衡量法)	タンク	容量10 L		1個1目盛につき	103,400	校正する目盛を1カ所追加する毎に51,700円を加算する。
			容量50 L以上100 L以下		1個1目盛につき	153,900	校正する目盛を1カ所追加する毎に76,900円を加算する。
			容量100 Lを超え200 L以下		1個1目盛につき	216,300	校正する目盛を1カ所追加する毎に108,100円を加算する。
		ピュレット(出用)	2 L以下のもの		1個3箇所まで	75,300	校正する目盛を1カ所追加する毎に7,000円を加算する。
		フラスコ(出用)	全量1 L以上10 L以下		1個につき	71,300	
14	音響	音場感度(計測用マイクロホン)	形20 Hz以上12.5 kHz以下、形20 Hz以上20 kHz以下、WS3形20 Hz以上20 kHz 以下		1個1校正周波数につき	74,800	1校正周波数を追加する毎に2,200円を加算する。

			WS3形 20 kHz以上100 kHz以下	1個1校正周波数につき	109,400	1校正周波数を追加する毎に18,400円を加算する。
		音圧感度(計測用マイクロホン)	形(1 Hz以上20 Hz以下)	1個1校正周波数につき	133,700	1校正周波数を追加する毎に11,300円を加算する。
		音響校正器	発生音圧レベル: 94 dB 以上 124 dB 以下 周波数範囲: 31.5 Hz 以上 16 kHz 以下	1台, 1音圧レベル, 1周波数につき	36,600	1音圧レベル, または1周波数点を追加する毎に3,500円追加する。
		音響パワーレベル(基準音源)	50 Hz 以上20 kHz 以下 (1/3 octave band)	1個につき	310,800	基準音源の電源周波数として50 Hz もしくは60 Hz のうち1つを指定。
			100 Hz 以上10 kHz 以下 (1/3 octave band)	1個につき	273,500	基準音源の電源周波数として50 Hz もしくは60 Hz のうち1つを指定。
15	超音波	音場感度(ハイドロホン)	100 kHz以上1 MHz以下(周波数間隔50 kHz、19点校正)	1個19周波数につき	232,700	
			0.5 MHz以上20 MHz以下	1個1周波数につき	139,300	1周波数を追加する毎に600円を加算する。 (参考例) 1 MHz毎に1 MHzから20 MHzまで校正する場合の料金は150,700円(20校正点) 0.1 MHz毎に0.5 MHzから20 MHzまで校正する場合の料金は 256,300円(196校正点)
			21 MHz 以上40 MHz 以下(周波数間隔1 MHz、20周波数以内)	1個20周波数以内につき	153,500	メムレン型ハイドロホン(受波部直径公称値0.5 mm 以下)
			41 MHz以上60 MHz以下(周波数間隔1 MHz、20周波数以内)	1個20周波数以内につき	175,400	メムレン型ハイドロホン(受波部直径公称値0.5 mm以下)
		超音波音場パラメタ	0.5 MHz以上20 MHz以下	1個1周波数1測定面につき	50,300	
		超音波パワー	1 mW以上15 W以下(0.5 MHz以上15 MHz以下) 1 mW以上500 mW以下(15 MHz以上20 MHz以下)	1個1周波数又は1パワーにつき	75,500	1周波数又は1パワーを追加する毎に46,200円を加算する。
			15 W以上100 W以下(1 MHz以上3 MHz以下)	1個1周波数又は1パワーにつき	83,000	1周波数又は1パワーを追加する毎に19,300円を加算する。
16	振動加速度	位相シフト	振動数: 20 Hz から5 kHzの1/3オクターブ毎の25点	1個につき	143,000	振動ピックアップの取付に関わる治具等の費用は含まない。
			振動数: 1 Hzから40 Hzの1/3オクターブ毎の16点	1個につき	121,500	振動ピックアップの取付に関わる治具等の費用は含まない。
17	衝撃加速度	電圧感度	ピーク加速度: 50 m/s <sup>2</sup> 以上10 000 m/s <sup>2</sup> 以下	1個2校正点 (1 000 m/s <sup>2</sup> , 5 000 m/s <sup>2</sup> ) につき	124,400	加速度センサの取付及び特殊な形状の治具制作等の費用は含まない。 2校正点を超え1校正点を追加する毎に37,300円を加算する。
		電荷感度	ピーク加速度: 50 m/s <sup>2</sup> 以上10 000 m/s <sup>2</sup> 以下	1個2校正点 (1 000 m/s <sup>2</sup> , 5 000 m/s <sup>2</sup> ) につき	178,300	加速度センサの取付及び特殊な形状の治具制作等の費用は含まない。 2校正点を超え1校正点を追加する毎に45,600円を加算する。
18	角振動・角速度	ジャイロ스코ープ	-5.2 rad/s ~ +5.2 rad/s (-0.087 rad/s を超え0.087 rad/s 未満の範囲を除く。) [ -300 °/s ~ +300 °/s (-5 °/s を超え5 °/s 未満の範囲を除く。)]	1個10校正点まで	153,000	アナログ出力に限る。 1校正点を追加する毎に、11,500 円を加算する。



19	直流・低周波	変流器	試験変流器の同相誤差、直角相誤差が(1%, 1%)より小さいもの 試験周波数: 45, 50, 55, 60, 120, 200, 400, 700, 1 000 Hz 試験変流比: 1以上1 000以下 試験1次電流5 A以上100 A以下	1個1周波数帯 1試験変流比 レンジ1電流に つき (試験変流比 の各レンジに おける10試験 点数まで)	507,000	他の試験と組み合わせる場合は1点を追加する 毎に105,900円を加算する。 10試験点数を超える場合は1点を追加する毎 に105,900円を加算する。
			試験変流器の同相誤差、直角相誤差が(1%, 1%)より小さいもの 試験周波数: 2 000, 4 000 Hz 試験変流比: 1以上1 000以下 試験1次電流5 A以上50 A以下	1個1周波数帯 1試験変流比 レンジ1電流に つき (試験変流比 の各レンジに おける10試験 点数まで)	507,000	他の試験と組み合わせる場合は1点を追加する 毎に105,900円を加算する。 10試験点数を超える場合は1点を追加する毎 に105,900円を加算する。
		蓄電キャパシタの内部インピーダ ンス	キャパシタンス(10 mF)	1個につき	112,200	校正依頼品は、内部起電力をもたない標準 用のキャパシタであること。
		蓄電池の内部インピーダンス測定器	1 ~ 100 / 1 kHz	1個19点につき	465,600	校正依頼品は、蓄電池の内部インピーダンス 測定器であって、4端子対定義に基づく測定 方式であること。計測器における直流電圧の 設定は、0 Vに限定する。 基本校正点は、1 ~ 10 (1 きざみ) 及 び、10 ~ 100 (10 きざみ)の計19点と する。 基本校正点以外のインピーダンス値を追加 する毎に、25,000円を加算する。
20	高周波	利得(ホーンアンテナ)	周波数: W バンド (75.0 GHz 以上 110.0 GHz 以下) 0.5 GHz 間隔の71 校正点	1個1バンドに つき	348,100	W バンドのフランジ付き方形導波管(導波管 規格: WR10、フランジ規格: UG-385 互換) を有する直線偏波ホーンアンテナ。ただし、 公称利得が15 dBi 以上 30 dBi 以下 の範 囲にあること。 校正する方向はアンテナの導波管端面に対 する垂直方向。
		応答非直線性(光パワーメータ)の波 長依存性試験	770 nm 帯、850 nm 帯、1 010 nm 帯: 1 nW レベルを基準とした応答非直線性(2 nW レベル以上1 mW レベル以 下)	1台1波長帯域 20 試験点まで	74,100	波長755 nm 以上 785 nm 以下、820 nm 以 上 860 nm 以下、または、970 nm 以上1 050 nm 以下の何れかの波長帯域におい て、任意の等間隔波長5点で測定した応答 非直線性の基準値からの最大偏差の大き さ。 空間ビーム系。 同一波長帯の応答非直線性(光パワーメー タ、空間ビーム系)の校正値(基準値)を有す ること。
		光ファイバパワー応答度(光パワーメ ータ)	850 nm 帯、光ファイバパワー 50 μW ~ 1 mW	1台24試験点 まで	104,100	波長840 nm 以上 860 nm 以下の範囲にお いて5 nm 間隔で応答非直線性を測定した 時の、波長850 nm での基準値、及び基準値 に対する最大偏差の大きさ。 光ファイバ系。 同一波長帯の応答非直線性(光パワーメー タ、光ファイバ系)の校正値(基準値)を有す ること。
						1パワーレベルを追加する毎に46,500 円を 加算する。 波長は 840 nm 以上 860 nm以下の範囲で 任意に選択可能。

		1310 nm 帯、光ファイバパワー 50 $\mu$ W ~ 1 mW	1台1波長点1 パワーレベル につき	125,100	1波長点1パワーレベルを追加する毎に 18,000円を加算する。 波長は 1260 nm 以上 1360 nm 以下の範 囲で任意に選択可能。	
		1550 nm 帯、光ファイバパワー 50 $\mu$ W ~ 1 mW	1台1波長点1 パワーレベル につき	124,600	1波長点1パワーレベルを追加する毎に 17,900円加算する。 波長は 1520 nm 以上 1630 nm 以下の範 囲で任意に選択可能。	
	光ファイバパワー応答度(光パワーメ ータ)の波長依存性試験	850 nm 帯、光ファイバパワー 50 $\mu$ W ~ 1 mW	1台1波長範囲 1パワーレベル につき	101,500	試験波長は840 nm 以上 860 nm 以下の任 意の連続波長範囲内で等波長間隔ごとに5 点。同一波長帯の光ファイバパワー応答度 (光パワーメータ)の校正値(基準値)を有す ること。	
		1 310 nm帯、光ファイバパワー50 $\mu$ W ~ 1 mW	1台1波長範囲 1パワーレベル につき	107,100	1試験波長範囲1パワーレベルを追加する毎 に36,100円を加算する。試験波長は1260 nm 以上 1360 nm以下の任意の連続波長範囲 内で等波長間隔ごとに11点。 同一波長帯の光ファイバパワー応答度(光パ ワーメータ)の校正値(基準値)を有すること。	
		1 550 nm帯、光ファイバパワー50 $\mu$ W ~ 1mW	1台1波長範囲 1パワーレベル につき	106,600	1試験波長範囲1パワーレベルを追加する毎 に35,900円を加算する。 試験波長は1520 nm 以上 1630 nm以下の 任意の連続波長範囲内で等波長間隔ごとに 11点。ただし、1520 nm - 1630 nmの範囲 で、10 nm間隔毎の場合は12点。 同一波長帯の光ファイバパワー応答度(光パ ワーメータ)の校正値(基準値)を有すること。	
	レーザーパワー	レーザー波長0.8 $\mu$ m レーザーパワー1 W以上10 W以下	1個1パワーに つき	172,900	1パワーを追加する毎に40,900円を加算す る。	
		レーザー波長 1.1 $\mu$ m レーザーパワー 1 kW	1個1パワーに つき	1,128,000		
	レーザーパワー(ビームプロファイラ)	レーザー波長1.06 $\mu$ m レーザーパワー1 mW以上1 W以下	1個1パワーに つき	205,700	校正器物は、CCDを用いたレーザービームプロ ファイラ。 1パワーを追加する毎に87,300円を加算す る。	
	電磁界強度	電界プローブ 周波数 2.45 GHz 電界強度 10 V/m	1個1電界ベク トル方向につ き	190,700	電界ベクトル方向を1 方向追加する毎に 42,900円を加算する。	
21	測光量・放射 量	分光応答度	紫外域 波長200 nm以上300 nm以下5 nm毎	1個につき	181,500	
			赤外域 波長800 nm以上 1 650 nm以下5 nm毎	1個につき	223,900	
		分光放射照度応答度	波長 360 nm 以上830 nm 以下5 nm毎	1個につき	185,400	オーバーフィル条件(A m <sup>2</sup> /W)による測定
		分光拡散反射率	(赤外域) 拡散反射板 波長:810 nm以上2 500 nm以下、10 nm間隔 反射率:80 %以上	1枚につき	268,200	2枚目以降の校正は、1枚につき109,900円を 加算する。(最大3枚まで)

		近・遠紫外域放射束	校正対象:重水素ランプ。校正波長180 nm-320 nm、10 nm ステップ 校正波長 ± 10.0 nm の波長幅内での放射束	1個につき	549,700	校正対象の代表的仕様(その他の仕様は直接ご確認ください)。 AC100 V 動作可の専用点灯電源を持ち、180 nm 320 nm の波長域の放射を持つ重水素ランプである事。バルブ底面に固定用の円盤型フランジを持つ構造である事。円盤型フランジには固定用の穴が2か所以上あり、3 mm 径以上の大きさである事。バルブ径は30 mm程度である事。固定用フランジから40 mm以上45 mm 以下の高さに発光部がある構造である事。
		N-9 分光全放射束 (4 放射光源用)	校正対象:ハロゲン電球(JD型、定格24 V,150 W) 波長:360 nm以上830 nm以下、5 nm間隔	電球1個につき	421,300	全光束の校正を含む。2~3個目は電球1個につき、114,700円を加算する。 ハロゲン電球は、十分な枯化、安定性確認、および再現性確認の実績を有するもので、規定の口金アダプタを装着のこと。
22	放射線	照射線量(率)測定器	マンモグラフィX線(Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh,W/Rh, W/Ag, W/Al)	1台1校正点につき	144,900	1点を追加する毎に39,600円を加算する。
		放射線量検出素子	マンモグラフィX線(Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh,W/Rh, W/Ag, W/Al)	1回照射につき	124,800	1照射を追加する毎に23,400円を加算する。
		放射線治療用水吸収線量測定器 (3校正点)	高エネルギー光子線(6, 10, 15 MV)	1台3校正点又は3試験点につき	244,500	基本料金の校正点は公称加速電圧が6MV、10MV、15MVの3点とする。1校正点又は1試験点を追加する毎に43,800円加算する。
		放射線治療用水吸収線量検出素子 (4校正点)	Co- 線, 高エネルギー光子線(6, 10, 15 MV)	1個4校正点につき	57,400	放射線治療用線量計の分離校正(対象計量器は要問合せ) 基本料金の校正点はCo- 線, 高エネルギー光子線 6 MV, 10 MV, 15 MVの4校正点とする。 1校正点を追加する毎に13,900円加算する。
		放射光軟X線フルエンス (現地校正)	単色軟X 線エネルギーの範囲:90 eV 以上 3900 eV 以下	1個1点につき	153,500	1点を追加する毎に 4,100円を加算する。 現地校正のみ。
		線	線組織吸収線量率測定器 線標準場を生成する線源の種類Sr/Y-90線源、Kr-85線源、Pm-147線源	1個1点につき	104,300	1点を追加する毎に16,600円を加算する。
			線組織吸収線量測定器 線標準場を生成する線源の種類Sr/Y-90線源、Kr-85線源、Pm-147線源	1個1点につき	112,700	1点を追加する毎に 24,900円を加算する。
			線組織吸収線量検出素子 線標準場を生成する線源の種類Sr/Y-90線源、Kr-85線源、Pm-147線源	1個1点につき	94,000	1点を追加する毎に18,700円を加算する。
			線水吸収線量率測定器 線標準場を生成する線源の種類Ru -106	1個1点につき	120,000	1点を追加する毎に14,500円を加算する。
			線水吸収線量測定器 線標準場を生成する線源の種類Ru -106	1個1点につき	127,300	1点を追加する毎に21,900円を加算する。
		基準空気カーマ率(ヨウ素125 密封小線源)	ヨウ素125 密封小線源	1個につき	114,000	1個追加する毎に 70,000円を加算する。 WS 使用の場合
			密封小線源測定器	1個につき	126,400	1個追加する毎に 82,400円を加算する。
		基準空気カーマ率イリジウム192 密封小線源)	密封小線源測定器	1台1校正点につき	199,900	
23	放射能	放射能濃度	4 - 測定装置による絶対測定校正試験 100 kBq/g 以上 2 MBq/g以下のもの	1個につき	68,800	
			電離箱又はGe半導体検出器による比較測定校正試験 20 Bq/g 以上 400 MBq/g以下のもの	1個につき	24,800	

			TDCR装置による絶対測定校正試験(H-3,C-14) 20 Bq/g 以上 400 MBq/g以下のもの	1個につき	231,600	
			液体シンチレーションカウンタによる比較測定校正試験 20 Bq/g 以上 400 MBq/g以下のもの (核種は問い合わせのこと)	1個につき	135,600	H-3標準溶液の供給がない場合、H-3での絶対測定校正試験と同時にを行うことが必要
		放射能濃度(放射性ガス)	1 Bq・cm <sup>-3</sup> 以上2 kBq・cm <sup>-3</sup> 以下のもの	1個につき	1,016,400	放射能(濃度)を1点追加することに173,500円を加算する。
		放射能試料	粒子放出率・スペクトル試験2 kBq以上4 MBq以下のもの	1試料につき	48,600	
			(X)線放出率の遠隔校正 範囲:2 ks <sup>-1</sup> 以上4 Ms <sup>-1</sup> 以下および50 keV以上1.8 MeV以下のもの	1個1核種につき	42,200	1核種を追加する毎に3,100円を加算する。
				初回設定手数料	12,400	
		放射能(放射性ガス)	5 kBq 以上3 MBq 以下のもの	1個につき	1,016,400	放射能(濃度)を1点追加することに173,500円を加算する。
		放射能測定器	校正試験20 Bq/g 以上400 MBq/g以下のもの	1個1核種につき	66,500	1核種を追加する毎に66,500円を加算する。
			線核種用放射能測定用電離箱の遠隔校正 範囲:40 kBq/g 以上400 MBq/g以下のもの	1個1核種につき	41,800	1核種を追加する毎に3,100円を加算する。
				初回設定手数料	12,200	
		放射性ガスモニタ	30 Bq・cm <sup>-3</sup> 以上100 Bq・cm <sup>-3</sup> 以下で担体ガスがPR ガス又はメタンガスであるもの	1個につき	1,041,000	放射能濃度を1点追加することに186,200円を加算する。
			30 Bq・cm <sup>-3</sup> 以上2 kBq・cm <sup>-3</sup> 以下で担体ガスが乾燥空気であるもの	1個につき	1,496,700	放射能濃度を1点追加することに151,000円を加算する。
		放射能面密度	Am-241コイン状線源0.3 Bq/cm <sup>2</sup> 以上1 MBq/cm <sup>2</sup> 以下のもの	1個につき	111,500	
			Cl-36大面積線源2 Bq/cm <sup>2</sup> 以上 1 kBq/cm <sup>2</sup> 以下のもの	1個につき	133,600	
		環境レベル放射能	体積線源の 線スペクトロメトリ20 Bq/g 以上100 kBq/g以下のもの	1個につき	91,300	
		線核種放射能	密封線源又はアンプル線源 線エネルギーが20 keV以上3 MeV以下で、2 kBq 以上4 MBq以下のもの	1個につき	62,900	
24	中性子	中性子測定器校正試験	速中性子フルエンス エネルギー点:144 keV, 565 keV, 5.0 MeV, 14.8 MeV フルエンス範囲:1.0 × 10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> 以上1.0 × 10 <sup>12</sup> /m <sup>2</sup> 以下	1個3試験点以下につき	249,300	4試験点以上6試験点以下は125,700円、7試験点以上9試験点以下は251,500円を加算する。
			速中性子フルエンス率 エネルギー点:144 keV, 565 keV, 5.0 MeV, 14.8 MeV フルエンス率範囲: 144 keV: 2.3 × 10 <sup>4</sup> /m <sup>2</sup> /s以上1.8 × 10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> /s以下 565 keV: 6.3 × 10 <sup>4</sup> /m <sup>2</sup> /s以上5.1 × 10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> /s以下 5.0 MeV: 2.5 × 10 <sup>4</sup> /m <sup>2</sup> /s以上2.0 × 10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> /s以下 14.8 MeV: 3.8 × 10 <sup>4</sup> /m <sup>2</sup> /s以上6.1 × 10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> /s以下	1個3試験点以下につき	249,300	4試験点以上6試験点以下は125,700円、7試験点以上9試験点以下は251,500円を加算する。
			速中性子フルエンス エネルギー点:2.5 MeV フルエンス範囲:1.0 × 10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> 以上1.0 × 10 <sup>11</sup> /m <sup>2</sup> 以下	1個3試験点以下につき	247,800	4試験点以上6試験点以下は124,800円、7試験点以上9試験点以下は247,800円を加算する。
			速中性子フルエンス エネルギー点:8.0 MeV(3.5 MeV補正照射なし) フルエンス範囲:1.0 × 10 <sup>7</sup> /m <sup>2</sup> 以上1.0 × 10 <sup>12</sup> /m <sup>2</sup> 以下	1個1試験点につき	103,700	1試験点を追加する毎に48,600円を加算する。

	速中性子フルエンス エネルギー点: 8.0 MeV (3.5 MeV補正照射あり) フルエンス範囲: $1.0 \times 10^7 / \text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{12} / \text{m}^2$ 以下	1個1試験点につき	171,500	1試験点を追加する毎に89,600円を加算する。
	速中性子フルエンス エネルギー点: 1.2 MeV フルエンス範囲: $1.0 \times 10^3 \text{ cm}^{-2}$ 以上 $1.0 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}$ 以下	1個1試験点につき	230,500	1試験点を追加する毎に76,300円を加算する(最大5点まで)。6試験点目以降は基本手数料を適用する。
	速中性子フルエンス率 エネルギー点: 1.2 MeV フルエンス率範囲: $1.6 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$ 以上 $1.4 \times 10^3 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$ 以下	1個1試験点につき	230,500	1試験点を追加する毎に76,300円を加算する(最大5点まで)。6試験点目以降は基本手数料を適用する。
	熱中性子フルエンス フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^7 \text{ m}^{-2}$ 以上 $1.0 \times 10^{12} \text{ m}^{-2}/\text{s}$ 以下	1個3試験点以下につき	285,800	4試験点以上6試験点以下は143,900円、7試験点以上9試験点以下は287,900円を加算する。
	熱中性子フルエンス率 フルエンス率範囲: $5.0 \times 10^5 \text{ m}^2/\text{s}$ 以上 $1.0 \times 10^8 \text{ m}^2/\text{s}$ 以下	1個3試験点以下につき	285,800	4試験点以上6試験点以下は143,900円、7試験点以上9試験点以下は287,900円を加算する。
	中速中性子フルエンス エネルギー点: 24 keV フルエンス範囲: $1.0 \times 10^7 / \text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{12} / \text{m}^2$ 以下	1個1試験点につき	144,800	1試験点を追加する毎に75,600円を加算する。
	中速中性子フルエンス率 エネルギー点: 24 keV フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^3 / \text{m}^2/\text{s}$ 以上 $1.6 \times 10^6 / \text{m}^2/\text{s}$ 以下	1個1試験点につき	144,800	1試験点を追加する毎に75,600円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス 線源種類: $^{252}\text{Cf}$ , Am-Be フルエンス範囲: $1.0 \times 10^7 / \text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{12} / \text{m}^2$ 以下	1個3試験点以下につき	249,300	4試験点以上6試験点以下は125,700円、7試験点以上9試験点以下は251,500円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス率 線源種類: $^{252}\text{Cf}$ , Am-Be フルエンス率範囲: Am-Be: $4.1 \times 10^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以上 $1.7 \times 10^2 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以下 $^{252}\text{Cf}$ : $2.0 \times 10^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以上 $4.9 \times 10^2 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 以下	1個3試験点以下につき	249,300	4試験点以上6試験点以下は125,700円、7試験点以上9試験点以下は251,500円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス (重水減速 $^{252}\text{Cf}$ ) フルエンス範囲: $8.8 \times 10^2 / \text{cm}^2$ 以上 $8.9 \times 10^7 / \text{cm}^2$ 以下	1個1試験点につき	144,100	1試験点を追加する毎に119,900円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス率 (重水減速 $^{252}\text{Cf}$ ) フルエンス率範囲: $1.7 \times 10^1 / \text{cm}^2/\text{s}$ 以上 $4.4 \times 10^2 / \text{cm}^2/\text{s}$ 以下	1個1試験点につき	144,100	1試験点を追加する毎に119,900円を加算する。
	高エネルギー中性子フルエンス率(現地校正) エネルギー点: 45 MeV フルエンス率範囲: $5.0 / \text{cm}^2/\text{s}$ ~ $2.5 \times 10^4 / \text{cm}^2/\text{s}$	1個1試験点につき	395,700	校正器物1個または1試験点追加する毎に26,800円を加算する。
中性子測定器照射試験	速中性子フルエンス エネルギー点: 144 keV, 565 keV, 5.0 MeV フルエンス範囲: $1.0 \times 10^7 / \text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{12} / \text{m}^2$ 以下	1照射につき	103,700	同じエネルギー点1照射を追加する毎に48,600円を加算する。
	速中性子フルエンス エネルギー点: 2.5 MeV フルエンス範囲: $1.0 \times 10^7 / \text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{11} / \text{m}^2$ 以下 エネルギー点: 14.8 MeV フルエンス範囲: $1.0 \times 10^7 / \text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{12} / \text{m}^2$ 以下	1照射につき	111,600	同じエネルギー点1照射を追加する毎に51,600円を加算する。
	速中性子フルエンス エネルギー点: 8.0 MeV (3.5 MeV補正照射なし) フルエンス範囲: $1.0 \times 10^7 / \text{m}^2$ 以上 $1.0 \times 10^{12} / \text{m}^2$ 以下	1照射につき	103,700	同じエネルギー点1照射を追加する毎に48,600円を加算する。

	速中性子フルエンス エネルギー点: 8.0 MeV (3.5 MeV補正照射あり) フルエンス範囲: $1.0 \times 10^7$ /m <sup>2</sup> 以上 $1.0 \times 10^{12}$ /m <sup>2</sup> 以下	1照射につき	171,500	1照射を追加する毎に89,600円を加算する。
	速中性子フルエンス エネルギー点: 1.2 MeV フルエンス範囲: $1.0 \times 10^3$ cm <sup>-2</sup> 以上 $1.0 \times 10^8$ cm <sup>-2</sup> 以下	1個1試験点につき	230,500	1照射を追加する毎に76,300円を加算する(最大5照射まで)。6照射目以降は基本手数料を適用する。
	熱中性子フルエンス率 フルエンス率範囲: $5.0 \times 10^5$ /m <sup>2</sup> /s 以上 $1.0 \times 10^8$ /m <sup>2</sup> /s 以下	1照射につき	88,300	1照射を追加する毎に82,100円を加算する。
	中速中性子フルエンス エネルギー点: 24 keV フルエンス範囲: $1.0 \times 10^7$ /m <sup>2</sup> 以上 $1.0 \times 10^{12}$ /m <sup>2</sup> 以下	1照射につき	144,800	1照射を追加する毎に75,600円を加算する。
	中速中性子フルエンス率 エネルギー点: 24 keV フルエンス率範囲: $1.0 \times 10^3$ /m <sup>2</sup> /s以上 $1.6 \times 10^6$ /m <sup>2</sup> /s以下	1照射につき	144,800	1照射を追加する毎に75,600円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス 線源種類: <sup>252</sup> Cf, Am-Be フルエンス範囲: $1.0 \times 10^7$ /m <sup>2</sup> 以上 $1.0 \times 10^{12}$ /m <sup>2</sup> 以下	1照射につき	131,300	1照射を追加する毎に97,600円を加算する。
	連続スペクトル中性子フルエンス (重水減速 <sup>252</sup> Cf) フルエンス範囲: $8.8 \times 10^2$ /cm <sup>2</sup> 以上 $8.9 \times 10^7$ /cm <sup>2</sup> 以下	1照射につき	137,700	1試験点を追加する毎に120,100円を加算する。
	高エネルギー中性子フルエンス率(現地校正) エネルギー点: 45 MeV フルエンス率範囲: $5.0$ /cm <sup>2</sup> /s ~ $2.5 \times 10^4$ /cm <sup>2</sup> /s	照射1時間につき	376,000	照射時間1時間追加する毎に、7,200円を加算する。
中性子個人線量計校正試験	中性子個人線量当量 線源種類: <sup>252</sup> Cf, Am-Be 線量当量範囲: $4.0 \times 10^{-4}$ mSv以上 $4.0 \times 10^1$ mSv以下 ( <sup>252</sup> Cf) $4.1 \times 10^{-4}$ mSv以上 $4.1 \times 10^1$ mSv以下 (Am-Be)	1個1試験点につき	131,700	1試験点を追加する毎に119,200円を加算する。
	中性子個人線量当量率 線源種類: <sup>252</sup> Cf, Am-Be 線量当量率範囲: $2.9 \times 10^{-8}$ Sv·h <sup>-1</sup> 以上 $7.1 \times 10^{-4}$ Sv·h <sup>-1</sup> 以下 ( <sup>252</sup> Cf) $6.0 \times 10^{-7}$ Sv·h <sup>-1</sup> 以上 $2.5 \times 10^{-4}$ Sv·h <sup>-1</sup> 以下 (Am-Be)	1個1試験点につき	131,700	1試験点を追加する毎に119,200円を加算する。
	中性子個人線量当量 (重水減速 <sup>252</sup> Cf) 線量当量範囲: $9.7 \times 10^{-5}$ mSv以上9.8 mSv以下	1個1試験点につき	137,900	1試験点を追加する毎に119,900円を加算する。
	中性子個人線量当量率 (重水減速 <sup>252</sup> Cf) 線量当量率範囲: $7.0 \times 10^{-6}$ Sv·h <sup>-1</sup> 以上 $1.8 \times 10^{-4}$ Sv·h <sup>-1</sup> 以下	1個1試験点につき	144,100	1試験点を追加する毎に119,900円を加算する。
中性子サーベイメータ校正試験	中性子周辺線量当量 線源種類: <sup>252</sup> Cf, Am-Be 線量当量範囲: $3.9 \times 10^{-4}$ mSv以上 $3.9 \times 10^1$ mSv以下	1個1試験点につき	131,700	1試験点を追加する毎に119,200円を加算する。
	中性子周辺線量当量率 線源種類: <sup>252</sup> Cf, Am-Be 線量当量率範囲: $2.8 \times 10^{-8}$ Sv·h <sup>-1</sup> 以上 $6.8 \times 10^{-4}$ Sv·h <sup>-1</sup> 以下 ( <sup>252</sup> Cf) $5.7 \times 10^{-7}$ Sv·h <sup>-1</sup> 以上 $2.4 \times 10^{-4}$ Sv·h <sup>-1</sup> 以下 (Am-Be)	1個1試験点につき	131,700	1試験点を追加する毎に119,200円を加算する。
	中性子周辺線量当量 (重水減速 <sup>252</sup> Cf) 線量当量範囲: $9.2 \times 10^{-5}$ mSv以上9.3 mSv以下	1個1試験点につき	144,100	1試験点を追加する毎に119,900円を加算する。

			中性子周辺線量当量率 (重水減速 <sup>252</sup> Cf) 線量当量率範囲: $6.6 \times 10^{-6}$ Sv/h以上 $1.7 \times 10^{-4}$ Sv/h以下	1個1試験点につき	144,100	1試験点を追加する毎に119,900円を加算する。
		中性子源校正試験	中性子放出率 線源種類: <sup>252</sup> Cf, Am-Be 中性子放出率範囲: $1.0 \times 10^3$ /s以上 $3.0 \times 10^7$ /s以下 ( <sup>252</sup> Cf) $1.0 \times 10^3$ /s以上 $2.0 \times 10^7$ /s以下 (Am-Be)	1個につき	104,200	
25	温度	ガラス製温度計	精密温度計(校正温度範囲:0 以上100 以下、1目量 0.02 以下)	1個0 のほか 5点まで	67,000	
		非接触温度計・校正装置	赤外放射温度計(160 以上500 以下のもの)	1個1点につき	143,400	1測定点を追加する毎に69,800円を加算する。
		極低温抵抗温度計	50 mK 以上 650 mK 以下(250 mKを超え400 mK 未満を除く)決められた24 温度のみで校正をおこなう。	1本につき	1,251,800	校正器物を同時に5本まで校正する場合、1 本追加につき26,200円を加算する。 【同時に6本以上8本以下で校正する場合】 237,000円を加算する他、6本を超える本数1 本につき26,800円を加算する。 【同時に9本以上12本以下で校正する場合】 362,600円を加算する他、9本を超える本数1 本につき26,200円を加算する。
26	湿度	露点計	露点範囲: +85 以上 +95 以下	1個1点につき	171,900	1測定点を追加する毎に50,600円を加算する。 (追加は最大2測点まで)
			露点範囲: -70 以上-10 以下	1個1点につき	270,100	測定点1点を追加する毎に54,000円を加算する。 (追加は最大6測点まで)
		物質分率表示が可能な微量水分計	ガス種:窒素 12 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/mol の6 校正点	1個6校正点ま でにつき	864,600	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
			ガス種:窒素 12 nmol/mol 以上 1 200 nmol/mol 以下	1個1点につき	510,200	校正点の値の±5 %以内、又は±1 nmol/mol 以内の差は許容とする。 1校正点を追加する毎に261,000円を加算する。
			ガス種:窒素 12 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/mol, 3 000 nmol/mol, 5 000 nmol/mol の8 校正点	1個8校正点ま でにつき	986,400	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
			ガス種:アルゴン 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/mol の6 校正点	1個6校正点ま でにつき	908,800	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol 以内の差は許容とする。
			ガス種:ヘリウム 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/molの6校正点	1個6校正点ま でにつき	1,044,200	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
			ガス種:酸素 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/molの6校正点	1個6校正点ま でにつき	1,154,600	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
		物質分率表示が可能な微量水分計の応答試験	12 nmol/mol 以上 1 200 nmol/mol 以下	1個、測定14日 間につき	675,000	1日追加する毎に59,000円を加算する。
27	熱物性	熱膨張率(線膨張係数)	試験対象物質:ガラス状炭素または単結晶シリコン 測定温度範囲:293 K以上1 000 K以下	1個につき	259,800	

			試験対象物質: JIS B7506 で定めるブロックゲージと同等な形状精度をもつ固体試験片 呼び寸法の範囲: 20 mm以上100 mm以下 測定温度範囲: 5 以上35 以下	1校正点につき	45,600	1校正点を追加する毎に20,500円を加算する。
	熱拡散率	4枚組(室温)		1件につき	133,800	
		4枚組(500 K+700 K+ 900 K+1 200 K)		1件につき	374,400	
		1枚組(室温)		1件につき	43,700	
		1枚組(高温 500 K以上1 200 K以下1点)		1件1点につき	60,700	1測定点を追加する毎に33,700円を加算する。
		1枚組(高温1 200 Kを超え1 500 K以下1点)		1件1点につき	68,200	1測定点を追加する毎に33,700円を加算する。
	比熱容量測定	1枚(300 K以上900 K以下の任意の温度1点)		1枚1点につき	73,100	1点を追加する毎に39,400円を加算する。
		1枚(900 K以上1 600 K以下の任意の温度1点)		1枚1点につき	74,300	1点を追加する毎に39,900円を加算する。
		1枚(50 K以上350 K以下の任意の温度1点)		1枚1点につき	152,900	1点を追加する毎に 56,000円を加算する。
	熱流密度	校正対象: 熱流センサ (1辺9 mm 以上50 mm 以下の平板状)		1個2点につき	156,600	2点を超え1点増す毎に、56,100円を加算する。
28	硬さ	ロックウェル硬さ標準片	Bスケール 30 HRBW 以上100 HRBW 以下	3個まで	120,200	
29	衝撃値	衝撃試験機		1台につき	283,300	検査対象試験機は、JIS B7740の基準機試験機に相当する試験機であること。
30	粒子・粉体特性	粒径	粒径20 nm以上300 nm以下	1試料につき	418,800	
			粒径100 nm以上1 μm以下	1試料につき	524,200	
		粒径分布幅 粒径20 nm以上300 nm以下の粒径標準ポリスチレンラテックス粒子		1試料につき	418,800	粒径分布幅は粒径の0.3倍以下
		粒径および粒径分布幅 粒径20 nm以上300 nm以下の粒径標準 ポリスチレンラテックス粒子		1試料につき	518,400	粒径分布幅は粒径の0.3倍以下
	粒子質量	粒子質量500 ag以上500 fg以下		1試料につき	459,900	
	粒子数濃度	気中 濃度 1 x 10 <sup>3</sup> cm <sup>-3</sup> 以上 4 x 10 <sup>3</sup> cm <sup>-3</sup> 以下(粒径 10 nm以上300 nm以下) 濃度 4 x 10 <sup>3</sup> cm <sup>-3</sup> 以上1 x 10 <sup>4</sup> cm <sup>-3</sup> 以下(粒径 10 nm以上200 nm以下) 濃度 1 x 10 <sup>0</sup> cm <sup>-3</sup> 以上1 x 10 <sup>5</sup> cm <sup>-3</sup> 以下(粒径 30 nm以上60 nm以下)		1台(5校正点を含む。)につき	494,000	1校正点を追加する毎に81,300円を加算する。
		液中 粒径 2 μm以上20 μm以下 濃度5 x 10 <sup>3</sup> 個/g以上2 x 10 <sup>4</sup> 個/g以下		1試料につき	582,000	希釈有
		液中 粒径 2 μm以上20 μm以下 濃度5 x 10 <sup>2</sup> 個/g 以上5 x 10 <sup>3</sup> 個/g 未満		1試料につき	576,700	希釈無
		液中 粒径 600 nm以上 2 μm 未満 濃度 5 x 10 <sup>2</sup> 個/g 以上 1 x 10 <sup>3</sup> 個/g 未満		1試料につき	625,100	希釈無
		液中 粒径 600 nm 以上 2 μm 未満 濃度 1 x 10 <sup>3</sup> 個/g 以上 2 x 10 <sup>6</sup> 個/g 以下		1試料につき	630,400	希釈有



		気中粒子数	光散乱式気中粒子計数器の検出効率(粒子数基準および粒子数濃度基準) 粒子計数頻度: $10\text{ s}^{-1} \sim 100\text{ s}^{-1}$ 粒径範囲: $0.5\ \mu\text{m} \sim 10\ \mu\text{m}$	1台につき(2粒径、1粒子計数頻度)	243,700	3粒径以上の場合には、1粒径につき25,800円を加算する。同一粒径において粒子計数頻度を追加する場合には、10,700円を加算する。粒径は以下の または のシリーズから選択し、このシリーズの中から粒径を選択する。 $10\ \mu\text{m}, 6\ \mu\text{m}, 3\ \mu\text{m}, 2\ \mu\text{m}, 1\ \mu\text{m}, 0.7\ \mu\text{m}, 0.5\ \mu\text{m}$ $5\ \mu\text{m}, 2\ \mu\text{m}, 1\ \mu\text{m}, 0.5\ \mu\text{m}$ 定格流量範囲: $0.3\ \text{L}/\text{min} \sim 30\ \text{L}/\text{min}$ (参考) 粒子数濃度流量 $30\ \text{L}/\text{min}$ の場合、 $0.02\ \text{cm}^{-3} \sim 0.2\ \text{cm}^{-3}$ 流量 $0.3\ \text{L}/\text{min}$ の場合、 $2\ \text{cm}^{-3} \sim 20\ \text{cm}^{-3}$
31	純度	高純度有機標準物質	核磁気共鳴法及び凝固点降下法による純度測定(純度範囲 98%以上100%以下)	1試料につき	157,600	
			核磁気共鳴法による純度測定(純度範囲 90%以上100%以下) ガスクロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	105,400	
			核磁気共鳴法による純度測定(純度範囲 90%以上100%以下) 高速液体クロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	99,800	
			凝固点降下法による純度測定(純度範囲 98%以上100%以下) ガスクロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	115,100	
			凝固点降下法による純度測定(純度範囲 98%以上100%以下) 高速液体クロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	111,300	
			核磁気共鳴法及び滴定法による純度測定(純度範囲 60%以上100%以下)	1試料につき	241,900	分析対象成分以外の有機化合物の総量が10%を超えないこと
32	薄膜・多層膜	膜厚	X線反射率法による薄膜・多層膜構造の膜厚校正(各層1nm以上200nm以下、総膜厚3nm以上200nm以下)	1個につき	258,600	1校正点を追加する毎に215,000円を加算する。
33	濃度	標準ガス	ホルムアルデヒドの濃度測定( $1\ \mu\text{mol}/\text{mol}$ 以上 $8\ \mu\text{mol}/\text{mol}$ 以下)	1試料につき	335,200	
34	分子量	高分子標準物質	静的光散乱法による質量平均モル質量 プルラン[CAS No. 9057-02-7] $2 \times 10^5\ \text{g mol}^{-1}$ 以上 $8 \times 10^5\ \text{g mol}^{-1}$ 以下	1試料につき	283,400	乾燥粉末状態のもの
51	計量器の構成要素及び検査装置の試験	はかりの制温装置(試験温度-10~60 )		1個につき	53,400	
		はかり・制温ばね等の温度による試験		1件につき	82,700	
		質量計用ターミナル・デジタルディスプレイ	NMIJ若しくはNMIJと相互承認を結んだ発行機関が発行したOIML適合証明書、又はNMIJが発行した試験報告書により審査し、新たな試験の実施を省略する場合の審査料	1件につき	49,700	
		JIS B 7611-2(環境試験レベルH)			395,400	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。試験器物を1台追加する毎に196,900円を加算する。
		JIS B 7611-2(環境試験レベルL)			220,600	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。試験器物を1台追加する毎に109,100円を加算する。
		型式の追加及び変更(個別項目)			127,300	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。試験器物を1台追加する毎に62,500円を加算する。 1試験項目を追加する毎に37,800円を加算する。

		型式の変更及び追加(試験なし)			49,700	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。	
質量計用指示計(アナログ信号)		NMIJ若しくはNMIJと相互承認を結んだ発行機関が発行したOIML適合証明書、又はNMIJが発行した試験報告書により審査し、新たな試験の実施を省略する場合の審査料	1件につき		49,700		
		JIS B 7611-2(環境試験レベルH)			877,600	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。 ただし、型式承認試験による環境試験データの活用が出来る場合には、263,200円を減算した額を基本料金とする。 試験器物を1台追加する毎に438,200円を加算する。	
		JIS B 7611-2(環境試験レベルL)			678,500	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。 ただし、型式承認試験による環境試験データの活用が出来る場合には、203,500円を減算した額を基本料金とする。 試験器物を1台追加する毎に338,600円を加算する。	
		型式の追加及び変更(個別項目)			218,000	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。 試験器物を1台追加する毎に108,400円を加算する。 1試験項目を追加する毎に65,400円を加算する。	
		型式の変更及び追加(試験なし)			49,700	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。	
質量計用ロードセル (OIML R60に対応する型式)		NMIJ若しくはNMIJと相互承認を結んだ発行機関が発行したOIML適合証明書、又はNMIJが発行した試験報告書により審査し、新たな試験の実施を省略する場合の審査料	1件につき		49,700		
	アナログロードセル	最大容量 100 kg 以上1 000 kg 以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき		434,600	器物を1台追加する毎に247,900円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき		448,800	器物を1台追加する毎に249,000円を加算する。 (一部試験については除外)
			型式の追加試験(計量性能試験)	1台につき		249,000	
			型式の追加試験(計量性能+湿度試験)	1台につき		427,900	
	アナログロードセル	最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき		575,400	器物を1台追加する毎に380,500円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき		595,500	器物を1台追加する毎に382,600円を加算する。 (一部試験については除外)
			型式の追加試験(計量性能試験)	1台につき		382,600	
			型式の追加試験(計量性能+湿度試験)	1台につき		566,600	
	デジタルロードセル	最大容量 100 kg 以上1 000 kg 以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき		877,200	器物を1台追加する毎に247,900円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき		891,400	器物を1台追加する毎に249,000円を加算する。 (一部試験については除外)

				型式の追加試験(計量性能試験)	1台につき	249,000	
				型式の追加試験(計量性能+湿度試験)	1台につき	427,900	
				型式の追加試験(影響試験)	1台につき	129,500	
				型式の追加試験(妨害試験)	1台につき	365,500	
		最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下		精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	1,018,100	器物を1台追加する毎に380,500円を加算する。 (一部試験については除外)
				精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	1,038,100	器物を1台追加する毎に383,100円を加算する。 (一部試験については除外)
				型式の追加試験(計量性能試験)	1台につき	382,600	
				型式の追加試験(計量性能+湿度試験)	1台につき	566,600	
				型式の追加試験(影響試験)	1台につき	202,000	
				型式の追加試験(妨害試験)	1台につき	365,500	
	ガスメーターの構成要素	膜(JIS B8571:2015 8.5.1.1)			1型式につき	88,000	
		計測部 基本性能試験(JIS B8571:2015 8.5.2~8.5.6)			1型式につき	294,800	
		計測部 耐久試験(JIS B8571:2015 8.5.7)			1型式につき	256,400	
		電子装置(JIS B8571:2015 8.5.11)			1型式につき	353,700	
	燃料油メーター用空気分離器				1個につき	88,500	
	燃料油メーター用ホース				1個につき	10,400	
	燃料油メーター用表示装置				1件につき	363,000	
	特定計量器外部接続装置の性能試験	タクシーメーター			1件につき	244,900	
		燃料油メーター用販売時点情報管理装置			1件につき	363,000	
	計量性能確認試験	最大容量100 kg以上1 000 kg以下	精度等級C6以下及びD		1台につき	249,000	
		最大容量2 500 kg以上20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD		1台につき	382,600	
	試験装置の認定試験	初回試験			1件につき	34,200	
		次回以降試験			1件につき	9,300	
52	その他	体積	200 L以下			46,400	予備ゲージを使用するものについては、1本を追加する毎に23,200円を加算する。 試験液が油の場合は、23,200円を加算する。

		200 Lを超えるもの			137,000	予備ゲージを使用するものについては、1本を追加する毎に68,500円を加算する。試験液が油の場合は、68,500円を加算する。	
	流量	石油用	口径80 mm以下	1個1流量につき	12,700		
			口径80 mmを超えるもの	1個1流量につき	18,000		
53	OIML適合性試験	既存のOIML適合証明書、OIML-MAA適合証明書、OIML-CS適合証明書又はNMIJが発行した試験報告書のみで審査する場合(新たな試験の実施を完全に省略する場合)の審査料 1件につき 49,700円 下記の手数料(基本料金)には審査料が含まれています。					
	非自動はかり	1992年版の技術基準に基づく証明書		1件につき	853,600	計量法に基づき型式承認試験等によって得られた試験成績書を用いる事により、新たな試験の実施を省略する場合がある。その際、669,900円(税別)を限度として、これを基本料金から減算する。	
		2006年版の技術基準に基づく証明書 完成はかり 試験対象:ひょう量 300 kgまで		1件につき	1,058,000	計量法に基づき型式承認試験等によって得られた試験成績書を用いる事により、新たな試験の実施を省略する場合がある。その際、680,500円(税別)を限度として、これを基本料金から減算する。	
	質量計用ロードセル	2000年版の技術基準に基づく証明書 アナログロードセル	タイプ:ビーム式 出力信号:アナログ信号 ひょう量:200 kg及び1 000 kg 湿度記号:NH 精度等級:C3(目量の数 3 000以下)及びD	1件につき	435,900		
		最大容量 100 kg 以上 1 000 kg 以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	478,200	器物を1台追加する毎に291,500円を加算する。 (一部試験については除外)	
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	492,400	器物を1台追加する毎に292,600円を加算する。 (一部試験については除外)	
			型式の追加試験(計量性能試験)	1台につき	292,600		
			型式の追加試験(計量性能+湿度試験)	1台につき	471,500		
		最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	619,000	器物を1台追加する毎に424,000円を加算する。 (一部試験については除外)	
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	639,000	器物を1台追加する毎に426,200円を加算する。 (一部試験については除外)	
			型式の追加試験(計量性能試験)	1台につき	426,200		
			型式の追加試験(計量性能+湿度試験)	1台につき	610,100		
		2000年版の技術基準に基づく証明書 デジタルロードセル	最大容量 100 kg 以上 1 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	920,800	器物を1台追加する毎に291,500円を加算する。 (一部試験については除外)
				精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	935,000	器物を1台追加する毎に292,600円を加算する。 (一部試験については除外)
				型式の追加試験(計量性能試験)	1台につき	292,600	
				型式の追加試験(計量性能+湿度試験)	1台につき	173,100	
				型式の追加試験(影響試験)	1台につき	471,500	
				型式の追加試験(妨害試験)	1台につき	409,000	

		最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	1,061,600	器物を1台追加する毎に424,000円を加算する。 (一部試験については除外)
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	1,081,600	器物を1台追加する毎に426,200円を加算する。 (一部試験については除外)
			型式の追加試験(計量性能試験)	1台につき	426,200	
			型式の追加試験(計量性能+湿度試験)	1台につき	610,100	
			型式の追加試験(影響試験)	1台につき	245,600	
			型式の追加試験(妨害試験)	1台につき	409,000	
			発行済みのOIML適合証明書、OIML-MAA適合証明書又はOIML-CS適合証明書の申請者名、申請者住所等の変更に伴う審査料			1件につき